

有機EL素子の劣化評価

雰囲気制御下での切削により加工による変質を抑制

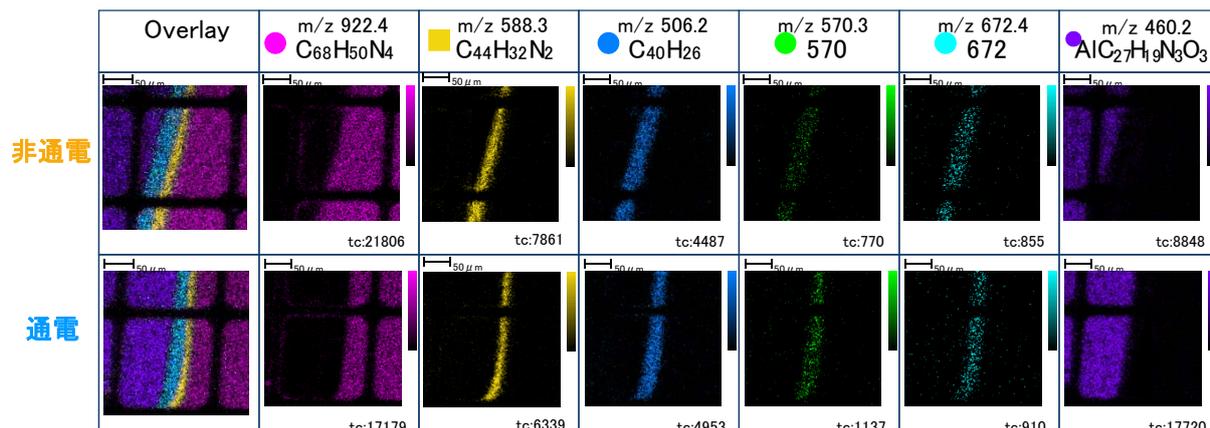
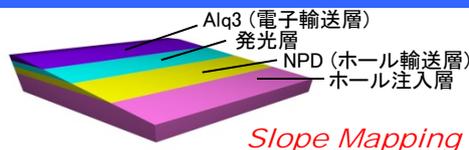
測定法 : TOF-SIMS
 製品分野 : ディスプレイ
 分析目的 : 組成評価・同定・化学結合状態評価・製品調査

概要

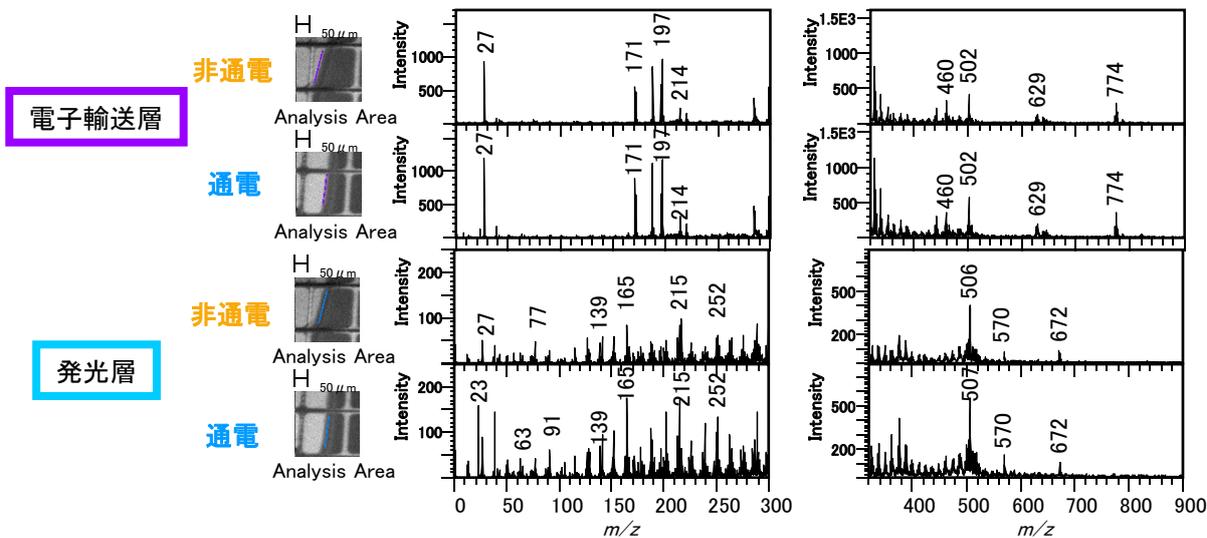
有機ELを搭載した市販のデジタルオーディオプレーヤーについて、通電により輝度が劣化したものと非通電のものとの比較を行いました。
 その結果、TOF-SIMSのスペクトルにはサンプル間で差は見られませんでした。

データ

■ 正イオンイメージ
 切削により、目的の層を露出させました。



■ 正イオンスペクトル



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！